

УДК 681.327.6:621.382

В. А. Агафонов, Л. С. Гарбая, Г. Н. Ехимов,  
А. Я. Елин, Н. П. Самров, Н. Н. Чесов

### СБИС ЗВ НА ОСНОВЕ УМС СЕРИИ К1682РЦ2 И К1682РЦ3

Накопители запоминающих устройств на основе цилиндрических магнитных ячеек К1682РЦ2 и К1682РЦ3 с информационной емкостью соответственно 269,65 кбит и 1,067 Мбит могут быть использованы для построения малогабаритных высоконадежных и энергонезависимых систем внешней и встраиваемой памяти минит и микроЭВМ и различных микропроцессорных устройства.

Микросхемы К1682РЦ2 и К1682РЦ3 имеют одинаковые конструкции: габаритные размеры, число и назначение выводов. Информационный массив этих схем с последовательно - параллельной организацией состоит из замкнутых регистров, в которых хранится и циклически перемещается в режиме обращения к ЗУ закодированная информация. Для ввода и вывода данных используются раздельные регистры. Недостаточность информационных регистров составляет соответственно 7,8 и 13,3%. Зпитаксиальные структуры микросхем состава  $(\text{Y}_{\text{Sm}} \text{Lu}_{\text{Ca}})_3(\text{Ge}_{\text{Fe}})_5\text{O}_{12}\text{C}$  диаметрами домена соответственно 3 и 1,9 мкм и намагниченность насыщения  $2,65 \cdot 10^{-2}$  и  $3,45 \cdot 10^{-2}$  Тл изготовлены с помощью традиционных процессов формирования слоев диэлектриков и металлов [1,2]. Кроме того, в ЗУ К1682РЦ3 для формирования токопроводящих элементов и переключателей использован процесс воздушного окисления пленки алюминия, позволяющий исключить искажение пермаллоевых элементов в местах их пересечения с токопроводящими шинами (рис.1). Кристаллы устанавливаются в пластмассовом корпусе с пермаллоевым экраном, содержащим постоянные магниты из барниевого феррита и электромагнитные катушки управления.

Основные технические характеристики схем приведены ниже.

	К1682РЦ2	К1682РЦ3
Полная информационная емкость, кбит.....	269,65	1231,8
Организация (слова x разряды).....	1025x260	2053x548
Рабочая частота, кГц.....	150	150
Скорость передачи данных, кбит/с.....	150	150
Среднее время выборки, мс.....	4,0	7,5
Потребляемая мощность, Вт.....	0,8	1,0
Размер кристалла, см.....	0,9x1,0	1,06x1,08
Диаметр УМД, мкм.....	3,0	1,9
Минимальный топологический размер, мкм.....	1,5	1,0
Габаритные размеры корпуса, мм.....		32,5x30x10
Шаг выводов, мм.....		2,5
Число выводов.....	18	
Масса, г.....		25

Запись информации в ЗУ осуществляется путем генерации заданной последовательности ЦМД (наличие ЦМД соответствует лог. 1), представляющей определенный информационный код. Ввод информации (передача данных из регистра ввода в регистры хранения) реализуется с помощью одноканального переключателя ввода для ЗУ К1602РЦ2 и двунаправленного переключателя обменного типа для ЗУ К1602РЦ3 (последний одновременно с вводом новой информации стирает информацию, подлежащую замене). Вывод информации (передача данных из регистра хранения в регистр вывода) производится с помощью переключателей репликаторного типа: гарантирующих неразрушающее считывание информации и сохранность данных при аварийном отключении источников питания. Генерация ЦМД, ввод данных и операция обмена информацией осуществляются импульсами тока треугольной формы. Операция репликации и последующего перевода адресов в регистр вывода данных — импульсом тока ступенчатой формы за коротким импульсом с большой амплитудой тока (репликация) сле- дует сравнительно длинный импульс меньшей амплитуды (вывод). Длительность им- пульсов управления и их положение отно- сительно нулевой фазы показаны на Рис. 2, амплитудные значения токов и выходного сигнала приведены ниже:

	K1602РЦ2	K1602РЦ3
Ток, мА		
через катушки ЭХО*	650(540) ± 10%	750(580) ± 10%
переключателя ввода-вывода	35 ± 20%	-
обмена	-	50 ± 20%
генератора	200 ± 10%	160 ± 10%
репликатора	100 ± 20%	180 ± 20%
детектора (постоянный)	6,5 ± 20%	3,5 ± 20%
Выходной сигнал с детектора,		
не менее: мВ	5	5
Отношение сигнал/шум,		
не менее	3	3



Рис.1. Фрагмент топологии кристаллов микросхемы К1602РЦ3

\*для токов треугольной формы.

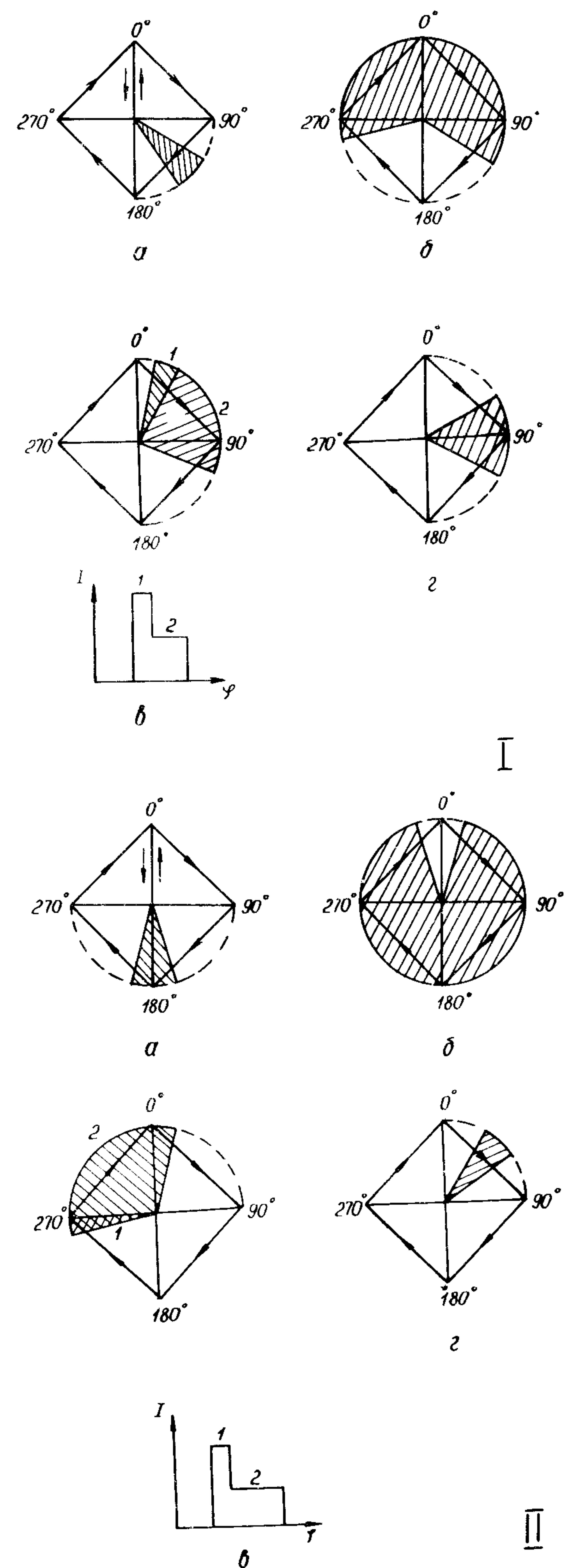


Рис.2. Фазовые диаграммы управляющих сигналов для микросхем К1602РЦ2 (I) и К1602РЦ3 (II): а—запись информационной последовательности данных; б—ввод и вывод страницы данных при записи и стирании информации; в—вывод страницы данных в режиме неразрушающего считывания информации (1—фаза репликации, 2—фаза вывода); г—считывание данных

Остановка и пуск поля управления должны производиться только в нулевой фазе, что обеспечивает высокую надежность устройства в режиме обращения к ЗУ и сохранность информационного кода. Основные зависимости микросхем приведены на рис.3. С ростом температуры окружающей среды наблюдается снижение уровня выходного сигнала, связанное с падением намагниченности ( $M_s$ ) домено-содержащего материала и уменьшением поля рассеяния ШМД. При увеличении тока датчика (в области малых токов) уровень выходного сигнала возрастает, достигает насыщения, затем начинает снижаться. Первоначальное увеличение сигнала датчика с ростом тока объяслено увеличением падения напряжения на датчике. Спад величины выходного сигнала вызван дополнительным локальным разогревом феррит-гранатовой пленки за счет тока, протекающего в детекторе, а также разогревом самого детектора и снижением магниторезистивных свойств пермаллоя.

Любая операция обращения к микросхеме осуществляется подачей управляющих сигналов в определенные такты поля управления в соответствии с алгоритмом работы ЗУ. Длительность стандартного цикла обращения к микросхеме К1602РЦ2 составляет 513 тактов поля управления, к микросхеме К1602РЦ3 - 684 такта. В рамках стандартного цикла обеспечивается запись и (или) считывание определенной страницы данных и подготовка следующей страницы к соответствующей операции. Таким образом, адрес той или иной страницы данных может быть представлен числом стандартных циклов работы ЗУ в режимах записи или считывания информации. При обращении к ЗУ необходимо исключить возможность записи информации в дефектные ячейки (регистры) в целях предотвращения изменения информационного кода. Если запись лог. "1" в дефектном регистре произошла, для восстановления работоспособности схемы рекомендуется произвести полную очистку содержащегося ЗУ путем подавления ШМД магнитным полем величиной 1600 А/м. Для стирания информации используется замкнутая металлическая петля, проходящая через специальные пазы в корпусе микросхемы. Дополнительное магнитное поле, создаваемое на кристалле одним витком, составляет 120 А/м при токе 1А. Таким же образом можно проводить оперативную очистку микросхемы от записанной информации.

Надежность работы микросхем характеризуется величиной области устойчивой работы по полю смещения при заданной частоте сбоев (рис.4). Указанные границы

области соответствуют вероятности появления ошибки в считанной информации, равной 10<sup>-2</sup>. Вблизи верхней границы основным видом нарушений записанной информации является коллапс ШМД при полном заполнении информационного массива; в нижней - появление ошибок связано с растяжением ШМД в полосовой домен.

Применением ЗУ на ШМД достигается значительное повышение надежности внешней памяти ЭВМ и более чем 10-кратное уменьшение габаритов и энергопотребления. При этом резко снижаются требования к условиям эксплуатации аппаратуры.

Для построения электронных блоков управления работой микросхем ЗУ ШМД в составе линейного модуля накопителя памяти разработан комплект универсальных схем управления КМ1144, включающий формирователь токов продвижения, усилитель считывания и функциональный генератор.

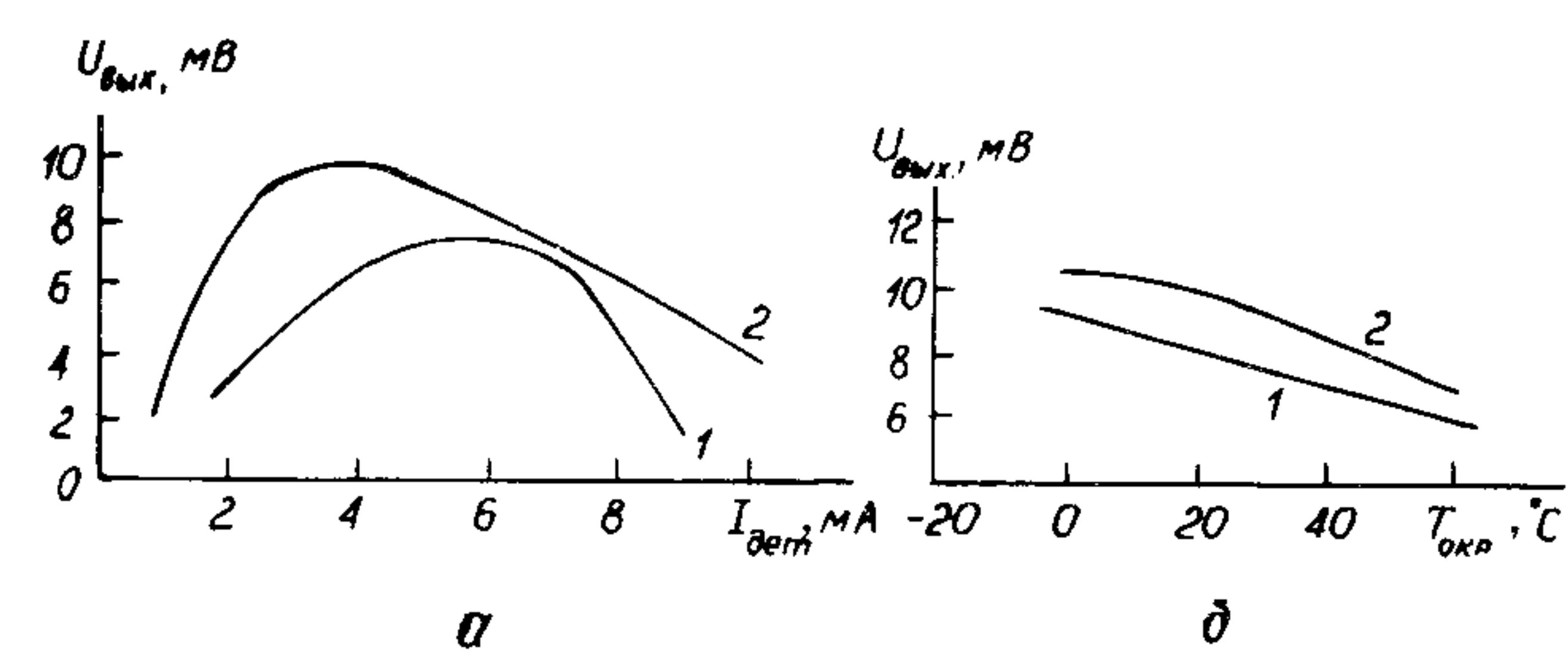


Рис.3. Зависимости выходного сигнала от величины тока детектора при температуре окружающей среды 25°C и величине поля управления 4кА/м (а) и от температуры окружающей среды (б): 1-для микросхемы К1602РЦ2; 2- для микросхемы К1602РЦ3

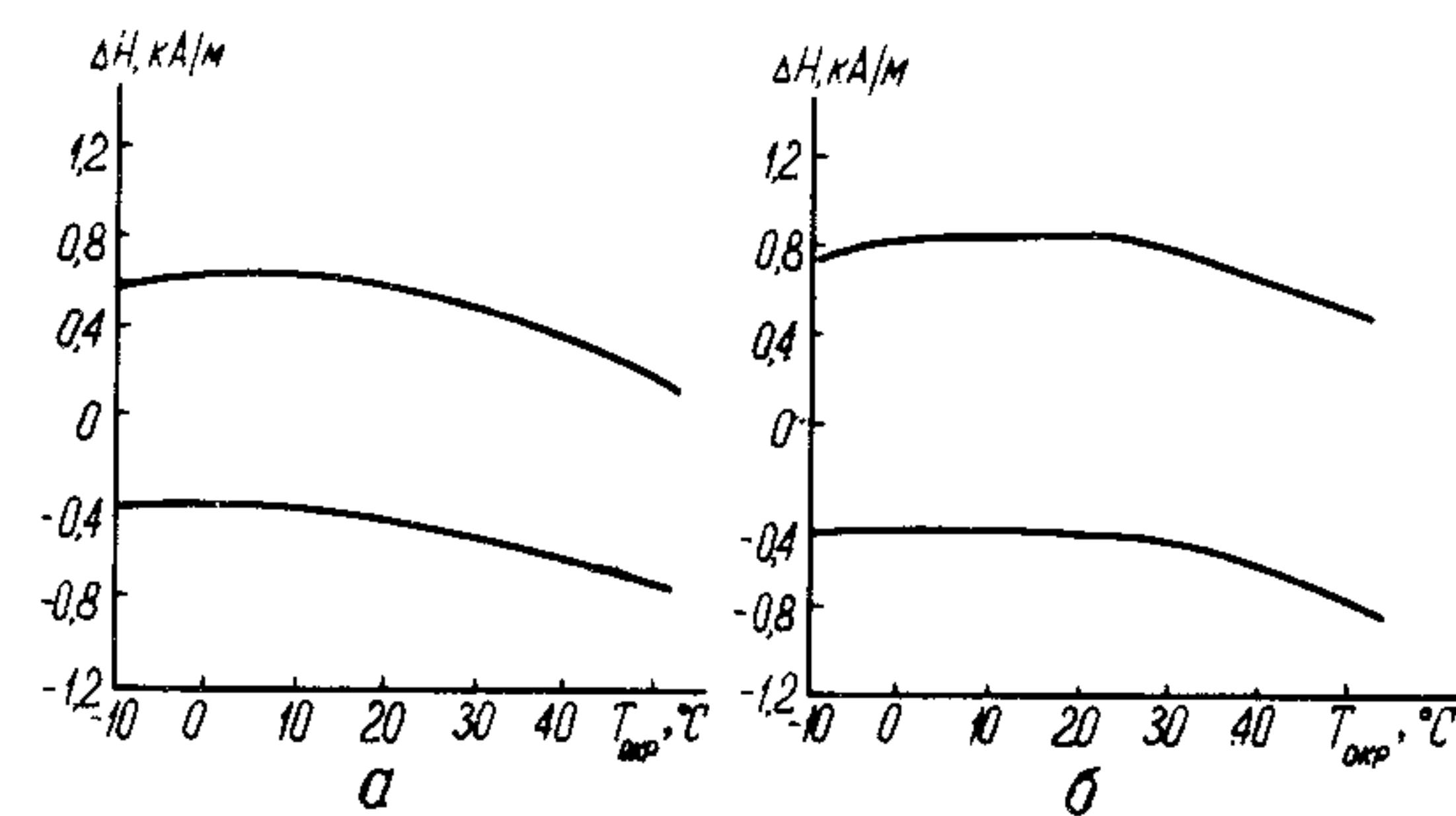


Рис.4. Интегральная область устойчивой работы микросхемы К1602РЦ2 при величине поля управления 4кА/м (а) и микросхемы К1602РЦ3 при 4,8кА/м (б). Рабочая частота 150 кГц